

# MTF 測定依頼書



会社名・組織名	株式会社 XYZ	依頼日	
所属	計測課	希望納期	
氏名	鈴木 太郎	※ 立ち会い測定希望日	
E-mail	xxxxxx@yyy.zzz.co.jp	※ 立ち会い測定を希望される方は立ち会い測定希望日をご記入下さい	
TEL	03-9999-xxxx		
FAX	03-9999-xxxx		

サンプル情報			
機種別	サンプル1	サンプル2	サンプル3
サンプル名称	P-DSC-Zoom10		
サンプル個数	1個		
カバーガラス 厚み / 支給可能	0.5mm / 不可		
EFL(mm)	6...58mm		
FB (mm) 像側基準面からの距離	-0.7		
F No.	1.6...4		
イメージサークル(mm)	φ5.6mm		
最大画角 (像高100% WIDE)	+/- 32deg		
最小画角 (像高100% TELE)	+/- 2.5 deg		
入射瞳位置 面頂～	W5mm/T14mm		
周辺光量比	MAX-48%		

測定条件			
空間周波数とピッチ (lp/mm)	0-250 / 25		
測定画角(像高) / ピッチ	+/- 30deg / 5deg.		
物体距離	∞ / 0.3m / 0.6m		
測定方位 (Sag/Tang/Both)	Both		
Optimize MTFと周波数	Center Tang / 120lp/mm		
測定波長	白色(Photopic Eye)		
ズームやアイリスなどのモーター制御	無し/指示書/立会いにて		
その他 希望される諸条件	1群のみ交換 (1群のみ3個)		

測定内容						
○=必須 △=測定希望 ×=不要 ※=計測費用次第						
無限遠測定	計測希望	測定断面方位	計測希望	測定断面方位	計測希望	測定断面方位
MTF vs. 空間周波数	○					
MTF vs. 像高mm(画角 deg)	○					
MTFスルーフォーカス vs. 像高	○					
MTF全方位(45度ピッチ8方位)のバランス(2Dグラフ)	○					
像面の倒れ(IMPro4グラフのみ)	△					
EFL(mm)	※					
BFL(mm)	×					
ディストーション (%)	○					
ディストーション (EFLvs.Field)	△					
焦点深度	※					
色収差 (可視域)	△					
非点収差	※					
その他 (ご相談)	Zemax シミュレーションと比較できる測定結果グラフで可能か?					
有限遠測定	計測希望	測定断面方位	計測希望	測定断面方位	計測希望	測定断面方位
物体距離 (10~800mm)	600mm					
MTF vs. 空間周波数	○					
MTF vs. 像高mm(画角 deg)	△					
MTFスルーフォーカス vs. 像高	※					
MTF全方位(45度ピッチ8方位)のバランス(2Dグラフ)	×					
その他 (ご相談)	共役長が10mm以下でも可能か?					

備考	試作品にて硬化が弱いので、取り扱いには十分注意してほしい。 室温(20-25度)で測定してほしい。
----	--